

ADC架构VIII：集成ADC

作者：Walt Kester和James Bryant

简介

在发现基本计数ADC架构（参见[指南MT-026](#)）后，通过结合集成和计数技术就能实现更高精度，进而推动了高精度双斜率、三斜率和四斜率ADC的开发。随着高分辨率 Σ - Δ 型ADC的迅速普及，集成架构不再像以前那样流行，不过仍用于各种精密应用，例如数字电压表等。

多斜率ADC

1950年代推出的“双斜率”ADC架构，对高分辨率应用中的ADC（例如数字电压表）确实是一大突破（参见参考文献1至4）。简单示意图如图1所示，积分器输出波形如图2所示。

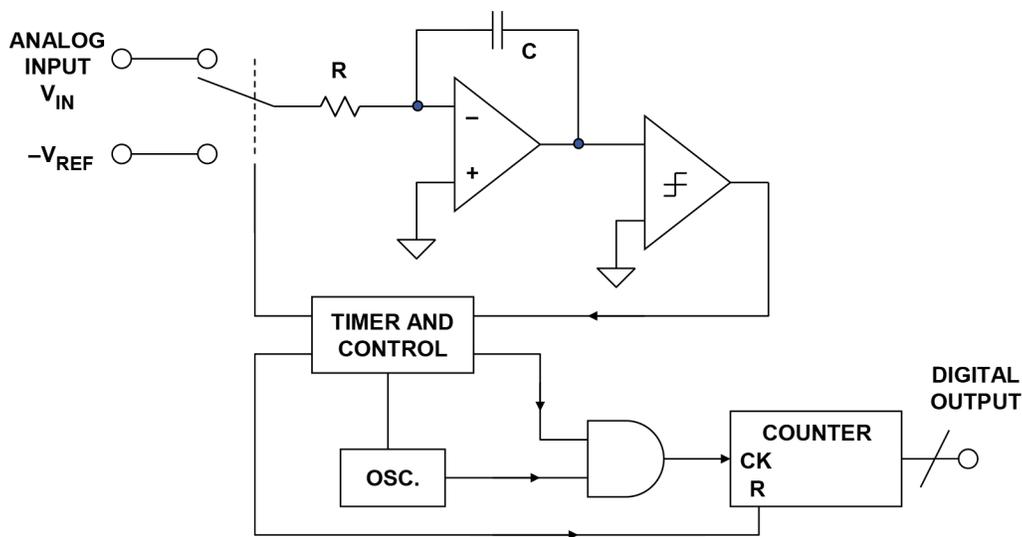


图1：双斜率积分ADC

计数器开始计算时钟脉冲的同时，输入信号施加于积分器。经过预定时间(T)后，具有相反极性的基准电压施加于积分器。此时，积分电容上的累积电荷与输入在间隔T内的平均值成正比。基准电压积分是反向斜坡，斜率为 V_{REF}/RC 。同时，计数器重新从零计数。当积分器输出到达零，计数停止，模拟电路复位。由于所得电荷与 $V_{IN} \times T$ 成正比，且相等数量的丢失电荷与 $V_{REF} \times t_x$ 成正比，因此相对于满量程计数的计数次数与 t_x/T 或 V_{IN}/V_{REF} 成正比。如果计数器输出是二进制数，那么就是代表输入电压的二进制形式。

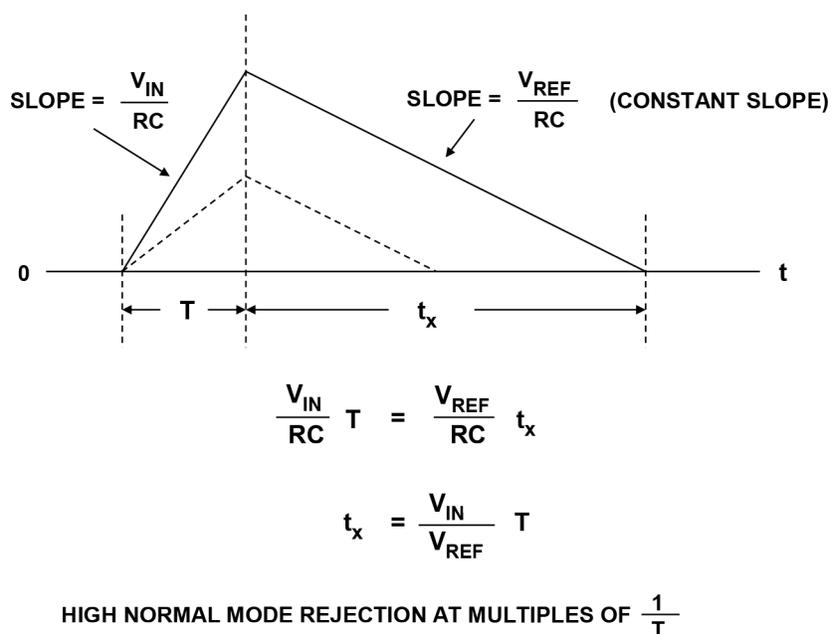


图2：双斜率ADC积分器输出波形

双斜率积分具有许多优点。由于转换精度以相同比率影响上行斜率和下行斜率，所以与电容和时钟频率均无关。

固定输入信号积分周期抑制了模拟输入（其周期等于积分时间 T 或为其约数）上的噪声频率。因此，只要正确选择 T ，就能实现对50-Hz和60-Hz线路纹波的极佳抑制，如图3所示。

利用额外充电/放电循环测量“零”和“满量程”，并借助测量结果对初始测量值进行数字校正，可以消除由偏置电流、积分放大器的失调电压和比较器造成的误差以及增益误差，如参考文献5所述的*四斜率*架构。

*三斜率*架构（参见参考文献6至8）保留了双斜率的优点，同时大幅提升了转换速度，但是增加了复杂性。提升转换速度通过在两个不同速率下完成基准电压积分（斜降）来实现，即高速速率和“游标”低速速率。计数器同样分成两部分，一部分用于MSB，一部分用于LSB。在正确设计的*三斜率*转换器中，可以实现速度的大幅提升，同时保留双斜率ADC固有的线性度、微分线性和稳定性特性。

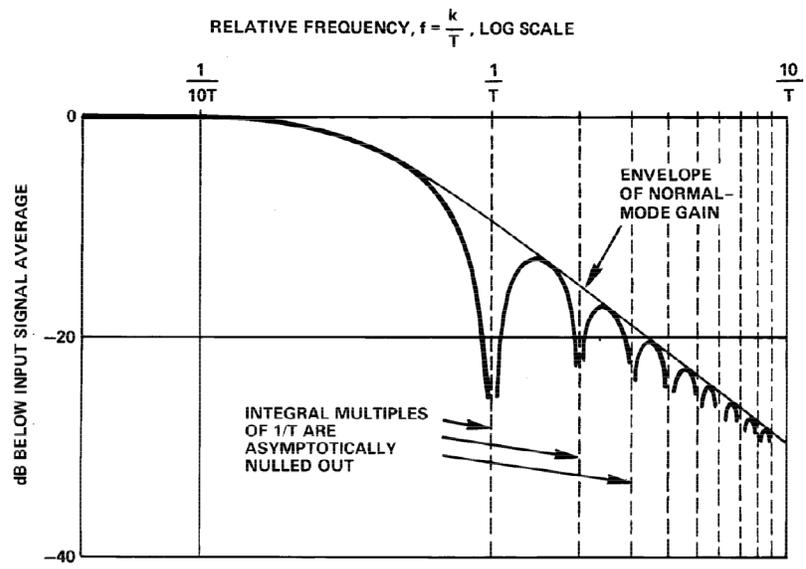


图3：积分ADC的频率响应

参考文献:

1. Robin N. Anderson and Howard A. Dorey, "Digital Voltmeters," *U.S. Patent 3,267,458*, filed August 20, 1962, issued August 16, 1966. (电荷平衡双斜率电压表ADC)。
2. Richard Olshausen, "Analog-to-Digital Converter," *U.S. Patent 3,281,827*, filed June 27, 1963, issued October 25, 1966. (电荷平衡双斜率ADC)。
3. Roswell W. Gilbert, "Analog-to-Digital Converter," *U.S. Patent 3,051,939*, filed May 8, 1957, issued August 28, 1962. (双斜率ADC)。
4. Stephan K. Ammann, "Integrating Analog-to-Digital Converter," *U.S. Patent 3,316,547*, filed July 15, 1964, issued April 25, 1967. (双斜率ADC)。
5. Ivar Wold, "Integrating Analog-to-Digital Converter Having Digitally-Derived Offset Error Compensation and Bipolar Operation without Zero Discontinuity," *U.S. Patent 3,872,466*, filed July 19, 1973, issued March 18, 1975. (四斜率ADC)。
6. Hans Bent Aasnaes, "Triple Integrating Ramp Analog-to-Digital Converter," *U.S. Patent 3,577,140*, filed June 27, 1967, issued May 4, 1971. (三斜率ADC)。
7. Frederick Bondzeit, Lewis J. Neelands, "Multiple Slope Analog-to-Digital Converter," *U.S. Patent 3,564,538*, filed January 29, 1968, issued February 16, 1971. (三斜率ADC)。
8. Desmond Wheable, "Triple-Slope Analog-to-Digital Converters," *U.S. Patent 3,678,506*, filed October 2, 1968, issued July 18, 1972. (三斜率ADC)。

© 2009 Analog Devices, Inc 保留所有权利。对于客户产品设计、客户产品的使用或应用，以及因ADI公司协助而可能导致的任何侵权，ADI公司概不负责。所有商标和标志均属各自所有人所有。ADI公司应用与开发工具工程师提供的信息准确可靠，但ADI公司对其技术指南所提供内容的技术准确性和时效性不承担责任。